Resid PGT/PTO 116 DEC 2004 10/51829 PATENT COOPERATION TREA



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

anslation	INTERNATION	ONAL PRELIMINA	RY EXAMIN	ATION REPORT
		(PCT Article 3	and Rule 70)	
Applicant's or agent's		FOR FURTHER ACT	ION See Notifi	ication of Transmittal of Internati Examination Report (Form PCT/IPEA/4
International application PCT/DE20		International filing date 05 June 2003 (0	•	Priority date (day/month/year) 17 June 2002 (17.06.2002)
International Patent C G06F 17/50		lational classification and l	PC	
Applicant		INFINEON TECHN	IOLOGIES AG	
and is transm	itted to the applicant a	nination report has been proceeding to Article 36.		national Preliminary Examining Authori
70.16	led and are the basis for and Section 607 of the	nied by ANNEXES, i.e., shor this report and/or sheets and/or sheets and an arraction of 6 sh	containing rectific ns under the PCT).	tion, claims and/or drawings which have ations made before this Authority (see
3. This report c	ontains indications rela	ating to the following item	s:	
ı 🖂	Basis of the report			
п	Priority Priority			
ш	Non-establishment	of opinion with regard to	novelty, inventive s	step and industrial applicability
IV 🗌	Lack of unity of in	vention		
v 🛚	Reasoned statemen citations and expla	at under Article 35(2) with nations supporting such sta	regard to novelty, i itement	inventive step or industrial applicability;
vi 🗌	Certain documents	cited	•	
VII 🗌	Certain defects in t	the international applicatio	n	
vm 🗌	Certain observation	ns on the international app	lication	
Date of submission	of the demand		Date of completion	of this report
31 De	ecember 2003 (31.	12.2003)	2	4 June 2004 (24.06.2004)
Name and mailing a	ddress of the IPEA/EF	,	Authorized officer	
1		ī		



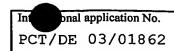


ational application No.

PCT/DE2003/001862

1. 1.	4313	or the re	μοι ε		
1.	With	regard to	the elements of the international application:*		
	\neg	the inte	mational application as originally filed		1
i	$\overline{\boxtimes}$	the desc	ription:		
"		pages	1-20		, as originally filed
		pages			, filed with the demand
İ		pages		filed with the letter of	
١,					
	\boxtimes	the clair	ms:		
		pages			, as originally filed
		pages		_, as amended (together	with any statement under Article 19
		pages		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, filed with the demand
		pages	1-14 ,	filed with the letter of	28 May 2004 (28.05.2004)
	\boxtimes	the drav	vings:		
•		pages	1/5-5/5		, as originally filed
		pages			
		pages			
	г				
	L_] ^t	-	nce listing part of the description:		
		pages			
		pages			
		pages		filed with the letter of	
	the ir	nternation	o the language, all the elements marked above were avalal application was filed, unless otherwise indicated und ts were available or furnished to this Authority in the fol	er this item.	s Authority in the language in which which is:
			guage of a translation furnished for the purposes of inter		
ļ	Ħ		guage of publication of the international application (unc	· ·	23.1(6)).
	H		guage of the translation furnished for the purposes of	` ''	evamination (under Dule 55.2 and/
		or 55.3).		·
3.	3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:				
	닏	contair	ned in the international application in written form.		
	\square	filed to	gether with the international application in computer rea	adable form.	
		furnish	ed subsequently to this Authority in written form.		
		furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable	form.	
			atement that the subsequently furnished written sectional application as filed has been furnished.	quence listing does not	go beyond the disclosure in the
			atement that the information recorded in computer re irnished.	adable form is identical	to the written sequence listing has
4.		The an	nendments have resulted in the cancellation of:		
			the description, pages		
			the claims, Nos.		
			the drawings, sheets/fig		
5.			port has been established as if (some of) the amendmenthe the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental		nce they have been considered to go
*	in th	acement nis repor 70.17).	sheets which have been furnished to the receiving Offic t as "originally filed" and are not annexed to this	e in response to an invita report since they do no	tion under Article 14 are referred to t contain amendments (Rule 70.16
**		•	ent sheet containing such amendments must be referred	to under item 1 and anne.	xed to this report.
					-

INTERNATIONAL PREID. MARY EXAMINATION REPORT



V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty,	inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-14	YES
		Claims		NO .
	Inventive step (IS)	Claims	1-14	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-14	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents:

- D1: AKTUNA M. RUTENBAR R A, CARLEY L R: 'Device-Level Early Floorplanning Algorithms for RF Circuits' IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, Vol. 18, No. 4, April 1999 (1999-04), pages 375-388, XP002261206
- D2: US-B1-6 363 519 (GUCCIONE STEVEN A ET AL) 26 March 2002 (2002-03-26)
- D3: US-A-5 914 887 (JONES EDWIN E ET AL)
 22 June 1999 (1999-06-22)
- D4: US-A-6 052 677 (KITAJIMA HIRONOBU ET AL)
 18 April 2000 (2000-04-18)
- D5: US-B1-6 360 191 (BENNETT III FORREST H ET AL) 19 March 2002 (2002-03-19)
- D6: ARSLAN T ET AL: 'STRUCTURAL CELL-BASED VLSI
 CIRCUIT DESIGN USING A GENETIC ALGORITHM' 1996
 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND
 SYSTEMS (ISCAS). CIRCUITS AND SYSTEMS
 CONNECTING THE WORLD. ATLANTA,
 MAY 12 15, 1996, IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM
 ON CIRCUITS AND SYSTEMS (ISCAS), NEW YORK, IEEE,
 US, Vol. 4, 12 May 1996 (1996-05-12),
 pages 308-311, XP000704598 ISBN: 0-7803-3074-9

- D7: AHMAD I ET AL: 'DESIGN-SPACE EXPLORATION FOR HIGH-LEVEL SYNTHESIS' PROCEEDINGS OF THE ANNUAL INTERNATIONAL PHOENIX CONFERENCE ON COMPUTERS AND COMMUNICATIONS. PHOENIX,

 APR. 12 15, 1994, NEW YORK, IEEE, US,

 Vol. CONF. 13, 12 April 1994 (1994-04-12),

 pages 491-496, XP000462601
- D8: POWELL D J ET AL: 'ENGENEOUS DOMAIN INDEPENDENT,
 MACHINE LEARNING FOR DESIGN OPTIMIZATION'
 PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
 GENETIC ALGORITHMS. ARLINGTON, JUNE 4 7, 1989,
 SAN MATEO, MORGAN KAUFMANN, US, Vol. CONF 3,
 4 June 1989 (1989-06-04), pages 151-159,
 XP000236324
- D9: ZHUANG N ET AL: 'IMPROVED VARIABLE ORDERING OF BDDS WITH NOVEL GENETIC ALGORITHM' 1996 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS (ISCAS). CIRCUITS AND SYSTEMS CONNECTING THE WORLD. ATLANTA, MAY 12 15, 1996, IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS (ISCAS), NEW YORK, IEEE, US, Vol. 3, 12 May 1996 (1996-05-12), pages 414-417, XP000688881 ISBN: 0-7803-3074-9
- D10: AKIO SAKAMOTO ET AL: 'A MODIFIED GENETIC CHANNEL ROUTER' IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS, COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES, INSTITUTE OF ELECTRONICS INFORMATION AND COMM. ENG. TOKYO, JP, Vol. E77-A, No. 12, 1 December 1994 (1994-12-01), pages 2076-2083, XP000497867 ISSN: 0916-8508
- D11: KOSAK C ET AL: 'A PARALLEL GENETIC ALGORITHM FOR NETWORK-DIAGRAM LAYOUT' PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENETIC ALGORITHMS.

 SAN DIEGO, JULY 13 16, 1991, SAN MATEO,
 MORGAN KAUFMANN, US, Vol. CONF. 4, 13 July 1991

 (1991-07-13), pages 458-465, XP000260135
- D12: BRAND D: 'Hill climbing with reduced search space (logic optimization)' COMPUTER-AIDED DESIGN, 1988. ICCAD-88. DIGEST OF TECHNICAL

PAPERS. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SANTA CLARA, CA, USA 7-10 NOV. 1988, WASHINGTON, DC, USA, IEEE COMPUT. SOC. PR, US, 7 November 1988 (1988-11-07), pages 294-297, XP010013371 ISBN: 0-8186-0869-2

D13: VECCHI M P, KIRKPATRICK S: 'Global wiring by simulated annealing', IEEE TRANSACTION ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, Vol. CAD2, No. 4, October 1983 (1983-10), pages 215-222, XP009021045.

1. Novelty, inventive step

- 1.1 The claims are interpreted in the light of the observations in items 2.1 and 2.2.
- 1.2 The solution to this problem as proposed in claim 1 of the present application is novel (PCT Article 33(2)) and involves an inventive step (PCT Article 33(3)) for the following reasons:

Document D1, which is considered to be the closest prior art, discloses (using, as far as possible, the wording of claim 1 of the present application; the references in parentheses are to D1):

- a method for modifying design data for the production of a component, more particularly an integrated circuit arrangement (abstract), in which method
- modified design data are produced from design data and stored, the modified design data defining a geometrical design that is locally modified in comparison with the geometrical design of the design data (figure 3 "f g k h" marks a local area with the aid of a slice tree),

- an evaluation measure for the modified design data is determined from the modified design (page 377, column 2, second paragraph, "evaluation", page 379, column 2, second and third paragraphs),
- the evaluation measure for the modified design is compared with an evaluation measure for the design to be modified (page 377, column 2, 'ninth paragraph),
- and the unmodified design data are maintained or replaced by the modified design data, depending on the result of the comparison (page 377, column 2, ninth paragraph),
- a plurality of modification, comparison and decision cycles being carried out automatically by means of the replacement (page 378, column 1, first paragraph).

The subject matter of claim 1 differs essentially from the above in that, in the determination of the evaluation measure, a critical area as regards short circuits and interruptions is determined, defects of a predefined size distribution being taken into account in the determination of the critical area, said defects being chosen such that defects which arise during the production of the component are reproduced.

The problem addressed by the present invention is that of layout optimization, taking into account technical defects that arise during the production of the component.

The technical effect, in contrast to the prior art, is the attainment of an optimized layout in which

neither short circuits nor interruptions occur, even when typical defects arise during production.

The available prior art neither discloses nor suggests that manufacturing defects be taken into account in the determination of critical areas during layout optimization, nor is this obvious to a person skilled in the art.

For these reasons, claim 1 meets the PCT requirements for novelty and inventive step.

- 1.3 Dependent claims 12 and 14 are novel and inventive for the same reasons.
- 1.4 Claims 2-11 and 13 are dependent on claims 1 and 12, respectively, and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step.

2. Clarity

- 2.1 Claim 1 is not clear and does not comply with the requirements of PCT Article 6, because the subject matter for which protection is sought is not clearly defined. The following vague or functional statements do not enable a person skilled in the art to ascertain the technical features that are necessary for carrying out the stated functions:
 - "component": Since the addition of "more particularly an integrated circuit arrangement" has no limiting effect, but is merely given by way of example, the claim is not restricted to the production of an "electronic component", but could also be related to other technical fields, for example architecture. However, the description (page 1, lines 6 to 9) indicates indirectly that the invention relates to

electronic components. Claim 1 should be amended accordingly.

2.2 The same applies to claim 12.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAT GEBIET DES PATENTWESEN

PCT

REC'D 2 5 JUN 2004

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

T ALI							
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts In1242WO				WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des Internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)			
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01862			1862	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 17.06.2002			
Inte G0	mation 6F17	nale P 7/50	atentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und IPK			
	nelder						
INF	INEC	JN T	ECHNOLOGIES AG et	al.			
1.	Die bea	ser in uftraç	ternationale vorläufige Pro gten Behörde erstellt und v	üfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.			
2.	Die	ser B	ERICHT umfaßt insgesam	nt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.			
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).						
	Dies	se An	lagen umfassen insgesam	nt 6 Blätter.			
3.	Dies	ser Be	ericht enthält Angaben zu f	folgenden Bunkton.			
		×					
	I ⊠ Grundlage des Bescheids II □ Priorität						
IV D Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung			Mangelnde Finheitlichke	Autachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit			
	٧	\boxtimes	Begründete Feststellung	nach Regel 66.2 a)li) hinsichtlich der Neuhelt, der erfinderischen Tätigkeit und der arkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung			
	VI		Bestimmte angeführte U	nterlagen			
	VII			nternationalen Anmeldung			
	VIII		Bestimmte Bemerkunger	n zur internationalen Anmeldung			
				·			
Datur	n der l	Einreid	hung des Antrags	Datum der Fertigstellung dieses Berichts			
31.1	31.12.2003			24.06.2004			
Name beauf	und F tragter	Postan Behr	schrift der mit der internationa	alen Prüfung Bevollmächtigter Bedlensteter			
		Eur	ODÄISChes Patentamt	Anti-chas Palenten.			
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 6			+49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d Sohrt, W			
Fax: +49 89 2399 - 4465			: +49 89 2399 - 4465	Tel. +49 89 2399-7185			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01862

i	Grun	dlage	dee	Rori	ahta
١.	QI UII	uiaue	ues	Deri	CNIS

Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Be	Beschreibung, Seiten					
	1-2	20	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
	An	sprüche, Nr.					
	1-1	4	eingegangen am 28.05.2004 mit Telefax				
	Zei	chnungen, Blätter					
	1/5	-5/5	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
2.			e: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der Idung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern its anderes angegeben ist.				
	Die ein(Bestandteile stande gereicht; dabei hande	n der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache elt es sich um:				
		die Sprache der Üb (nach Regel 23.1(b)	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist)).				
		die Veröffentlichung	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).				
		die Sprache der Übe	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht egel 55.2 und/oder 55.3).				
3.	Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:						
		in der internationale	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.				
			nternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde nach	chträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
			chträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		Die Erklärung, daß o Offenbarungsgehalt	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.				
		Die Erklärung, daß d	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen itsprechen, wurde vorgelegt.				
1.	Aufg	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:				
		Beschreibung,	Seiten:				
		Ansprüche,	Nr.:				
		Zeichnungen,	Blatt:				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01862

5. 🗆	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den
	angegebenen Grunden nach Auftassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich
	eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-14

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-14

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-14

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: AKTUNA M, RUTENBAR R A, CARLEY L R: 'Device-Level Early Floorplanning Algorithms for RF Circuits' IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, Bd. 18, Nr. 4, April 1999 (1999-04), Seiten 375-388, XP002261206
- D2: US-B1-6 363 519 (GUCCIONE STEVEN A ET AL) 26. März 2002 (2002-03-26)
- D3: US-A-5 914 887 (JONES EDWIN E ET AL) 22. Juni 1999 (1999-06-22)
- D4: US-A-6 052 677 (KITAJIMA HIRONOBU ET AL) 18. April 2000 (2000-04-18)
- D5: US-B1-6 360 191 (BENNETT III FORREST H ET AL) 19. März 2002 (2002-03-19)
- D6: ARSLAN T ET AL: 'STRUCTURAL CELL-BASED VLSI CIRCUIT DESIGN USING A GENETIC ALGORITHM' 1996 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS (ISCAS). CIRCUITS AND SYSTEMS CONNECTING THE WORLD. ATLANTA, MAY 12 - 15, 1996, IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS (ISCAS), NEW YORK, IEEE, US, Bd. 4, 12. Mai 1996 (1996-05-12), Seiten 308-311, XP000704598 ISBN: 0-7803-3074-9
- D7: AHMAD I ET AL: 'DESIGN-SPACE EXPLORATION FOR HIGH-LEVEL SYNTHESIS' PROCEEDINGS OF THE ANNUAL INTERNATIONAL PHOENIX CONFERENCE ON COMPUTERS AND COMMUNICATIONS. PHOENIX, APR. 12 - 15, 1994, NEW YORK, IEEE, US, Bd. CONF. 13, 12. April 1994 (1994-04-12), Seiten 491-496, XP000462601
- D8: POWELL D J ET AL: 'ENGENEOUS DOMAIN INDEPENDENT, MACHINE LEARNING FOR DESIGN OPTIMIZATION' PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENETIC ALGORITHMS. ARLINGTON, JUNE 4 - 7, 1989, SAN MATEO, MORGAN KAUFMANN, US, Bd. CONF. 3, 4. Juni 1989 (1989-06-04), Seiten 151-159, XP000236324
- D9: ZHUANG N ET AL: 'IMPROVED VARIABLE ORDERING OF BDDS WITH NOVEL GENETIC ALGORITHM' 1996 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS (ISCAS). CIRCUITS AND SYSTEMS CONNECTING THE WORLD. ATLANTA, MAY 12 - 15, 1996,

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT



IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS (ISCAS), NEW YORK, IEEE, US, Bd. 3, 12. Mai 1996 (1996-05-12), Seiten 414-417, XP000688881 ISBN: 0-7803-3074-9

AKIO SAKAMOTO ET AL: 'A MODIFIED GENETIC CHANNEL D10: ROUTER' IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS, COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES, INSTITUTE OF ELECTRONICS INFORMATION AND COMM. ENG. TOKYO, JP, Bd. E77-A, Nr. 12, 1. Dezember 1994 (1994-12-01), Seiten 2076-2083, XP000497867 ISSN: 0916-8508

KOSAK C ET AL: 'A PARALLEL GENETIC ALGORITHM FOR D11: NETWORK-DIAGRAM LAYOUT' PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENETIC ALGORITHMS. SAN DIEGO, JULY 13 - 16, 1991, SAN MATEO, MORGAN KAUFMANN, US, Bd. CONF. 4, 13. Juli 1991 (1991-07-13), Seiten 458-465, XP000260135

BRAND D: 'Hill climbing with reduced search space (logic optimization)' D12: COMPUTER-AIDED DESIGN, 1988. ICCAD-88. DIGEST OF TECHNICAL PAPERS., IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SANTA CLARA, CA, USA 7-10 NOV. 1988, WASHINGTON, DC, USA,IEEE COMPUT. SOC. PR, US, 7. November 1988 (1988-11-07), Seiten 294-297, XP010013371 ISBN: 0-8186-0869-2

VECCHI M P, KIRKPATRICK S: 'Global wiring by simulated annealing' D13: IEEE TRANSACTION ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, Bd. CAD2, Nr. 4, Oktober 1983 (1983-10), Seiten 215-222, XP009021045

1. Neuheit, erfinderische Tätigkeit

- Die Ansprüche werden im Lichte des unter 2.1 und 2.2 Geschriebenen 1.1 interpretiert.
- 1.2 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung ist aus den folgenden Gründen neu (Artikel 33 (2) PCT) und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):
 - Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (soweit wie möglich den Formulierungen aus Anspruch 1 der

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



vorliegenden Anmeldung folgend, wobei die Referenzen in Klammern in Dokument D1 verweisen)

- ein Verfahren zum Verändern von Entwurfsdaten für die Herstellung eines Bauteils, insbesondere einer integrierten Schaltungsanordnung (Abstract),
- bei dem aus Entwurfsdaten veränderte Entwurfsdaten erzeugt und gespeichert werden, die einen im Vergleich zu dem geometrischen Entwurf der Entwurfsdaten lokal veränderten geometrischen Entwurf festlegen (Fig. 3 "f g k h" markiert einen lokalen Bereich mit Hilfe eines Slice Trees),
- bei dem aus den veränderten Entwurfsdaten für den veränderten Entwurf ein Bewertungsmaß ermittelt wird (S.377 Sp.2 §2 "evaluation", S.379 Sp.2 §2-3),
- bei dem das Bewertungsmass für den veränderten Entwurf mit einem Bewertungsmaß für den zu verändernden Entwurf verglichen wird (S.377 Sp.2 §9),
- und bei dem abhängig vom Vergleichsergebnis die unveränderten Entwurfsdaten beibehalten oder durch die veränderten Entwurfsdaten ersetzt werden (S.377 Sp.2 §9),
- wobei automatisch mehrere Zyklen von Veränderungen, Vergleichen und Entscheidungen über das Ersetzen durchgeführt werden (S.378 Sp.1 §1).

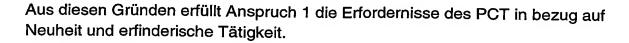
Davon unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 im Wesentlichen dadurch, dass beim Ermitteln des Bewertungsmaßes eine kritische Fläche bezüglich Kurzschlüssen und Unterbrechungen ermittelt wird, wobei die kritische Fläche unter Annahme von Defekten einer vorgegebenen Größenverteilung ermittelt wird, die so gewählt wird, dass bei der Herstellung des Bauelementes auftretende Defekte nachgebildet werden.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe ist eine Layout-Optimierung unter Berücksichtigung bei der Herstellung auftretender technischer Defekte.

Der technische Effekt im Gegensatz zum Stand der Technik ist die Erzielung eines optimierten Layouts, das auch unter typischerweise bei der Herstellung auftretenden Defekten weder Kurzschlüsse noch Unterbrechungen aufweist.

Im vorliegenden Stand der Technik ist die Einbeziehung von Herstellungs-Defekten in die Ermittlung kritscher Flächen während der Layout-Optimierung weder offenbart noch nahegelegt und ist für den Fachmann auch nicht offensichtlich.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



- 1.3 Die unabhängigen Ansprüche 12 und 14 sind aus den gleichen Gründen neu und erfinderisch.
- 1.4 Die Ansprüche 2-11 und 13 sind von Anspruch 1 bzw. 12 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

2. Klarheit

- Der Anspruch 1 ist nicht klar und erfüllt die Erfordernisse des Artikels 6 PCT insofern nicht, als der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. Die folgenden vagen oder funktionellen Angaben ermöglichen es einem Fachmann nicht, festzustellen, welche technischen Merkmale notwendig sind, um: die genannten Funktionen durchzuführen:
 - "Bauteil": da der Zusatz "insbesondere einer integrierten Schaltungsanordnung" nicht einschränkend, sondern lediglich beispielgebend formuliert ist, ist der Anspruch nicht auf die Herstellung eines "elektronischen Bauteils" beschränkt, sondern könnte auch auf andere Fachgebiete, z.B. Architektur, bezogen werden. Aus der Beschreibung (S. 1 Z. 6-9) geht allerdings indirekt hervor, dass sich die Erfindung auf elektronische Bauteile bezieht. Anspruch 1 sollte entsprechend angepasst werden.
- 2.2 Gleiches gilt für Anspruch 12.

R 10:10 FAX 0049 810 1898

PATENTANWALT KINDERMANN

1

Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Verändern von Entwurfsdaten für die Herstellung eines Bauteils, insbesondere einer integrierten Schal-
- tungsanordnung,
 - bei dem Entwurfsdaten vorgegeben werden (302), die einen zu verändernden geometrischen Entwurf (10) für ein Bauteil festlegen,
- bei dem aus den Entwurfsdaten veränderte Entwurfsdaten erzeugt und gespeichert werden (308), die einen im Vergleich zu
 dem geometrischen Entwurf (10) der Entwurfsdaten in einem Bereich (100) lokal veränderten geometrischen Entwurf (10a)
 festlegen,
- bei dem aus den veränderten Entwurfsdaten (10a) für den ver15 anderten Entwurf (10a) ein Bewertungsmaß (BM1, GBM) ermittelt
 wird (312),
 - wobei beim Ermitteln des Bewertungsmaßes eine für den veränderten Entwurf oder Bereich (100) ermittelte kritische Fläche bezüglich Kurzschlüssen und/oder eine für den veränderten
- 20 Entwurf (10a) oder in dem Bereich (100) ermittelte kritische Fläche bezüglich Unterbrechungen ermittelt wird (310), bei dem das Bewertungsmaß (GBM) für den veränderten Entwurf (10a) mit einem Bewertungsmaß (BM1, GBM) für den zu verändernden Entwurf (10) verglichen wird (314),
- 25 bei dem abhängig vom Vergleichsergebnis die unveränderten Entwurfsdaten beibehalten oder durch die veränderten Entwurfsdaten ersetzt werden (316, 318), wobei automatisch mehrere Zyklen von Veränderungen, Vergleichen und Entscheidungen über das Ersetzen durchgeführt wer-
- 30 den, und bei dem die kritischen Fläche unter Annahme von Defekten einer vorgegebenen Größenverteilung ermittelt wird, wobei die

10:10 FAX 0049 In1242WOAD8.doc. 28.05.04

PCT/DE03/01862

301898

PATENTANWALT KINDERMAND

Größenverteilung so gewählt wird, dass bei der Herstellung des Bauelementes auftrelende Defekte nachgebildet werden.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch qekennzeichnet, dass ein Bereich (100) für die lokale Veränderung und/oder die Größe dieses Bereiches (100) ohne Nutzung einer Zufallsfunktion ermittelt wird, oder dass ein Bereich (100) für die lokale Veränderung und/oder die Größe dieses Bereiches unter Nutzung einer Zufallsfunktion ermittelt wird. 10
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch kennzeichnet, dass ein Bereich (100) für die lokale Veränderung und/oder die Größe dieses Bereiches (100) gemäß einer Gleichverteilung oder mit einer Begünstigung von Berei-15 chen und/oder Größen ausgewählt wird, die die Veränderung des Bewertungsmaßes (GBM) hin zum Ziel des Verfahrens besonders beeinträchtigen.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da -20 gekennzeichnet, dass für das Erzeugen der veränderten Entwurfsdaten (10a) in dem durch die zu verändernden Entwurfsdaten festgelegten Entwurf ein Bereich (100) ausgewählt wird,
- dass Entwurfsdaten ermittelt werden, welche den Entwurf in 25 dem ausgewählten Bereich (100) betreffen. und dass die ermittelten Entwurfsdaten gemäß einer vorgegebenen Funktion verändert werden, die eine Geometrieveränderung des Entwurfs in dem ausgewählten Bereich bewirkt.
 - gekenn. 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch z e i c h n e t , dass die Geometrieveränderung eine Verschiebung (308) eines Entwurfsteils in dem Bereich (100) um eine

BEST AVAILABLE COPY

30

01898 10:10 FAX 0049 81 in1242WQADB.doc. 28.05.04 FCT/DE03/01862

PATENTANWALT KINDERMANN

vorgegebene Strecke oder um eine vorgegebene Anzahl von Punkten eines Rastermaßes und in einer vorgegebenen Richtung ist, und/oder dass die Geometrieveränderung eine Spiegelung eines Entwurfsteils in dem Bereich (100) an einer vorgegebenen

Spiegelachse ist,

und/oder dass die Geometrieveränderung eine Drehung eines Entwurfsteils in dem Bereich (100) um einen vorgegebenen Drehpunkt und einen vorgegebenen Drehwinkel ist, und/oder dass die Geometrieveränderung eine gleichmäßige oder ungleichmäßige Dehnung oder Stauchung eines Entwurfsteils in dem Bereich (100) entlang mindestens einer vorgegebenen Rich-

tung und um mindestens einen vorgegebenen Skalierungsfaktor

ist,

10

15

und/oder dass die Geometrieveränderung eine Glättung von Linien eines Entwurfsteils in dem Bereich (100) betrifft, und/oder dass die Geometrieveränderung ein Ersetzen des Entwurfsteils in dem ausgewählten Bereich (100) durch einen Entwurfsteil aus einem anderen Bereich des Entwurfs oder durch einen vorgegebenen Entwurfsteil oder durch einen entsprechen-20 den Entwurfsteil eines Entwurf aus einem früheren Zyklus des Verfahrens ist, wobei der entsprechende Bereich an der gleichen Stelle im Entwurf liegt, wie der ausgewählte Bereich oder eine ähnliche Geometrie wie der ausgewählte Bereich hat, und wobei der entsprechende Bereich vorzugsweise ein Bereich aus dem besten bisher in dem Verfahren ermittelten Entwurf

ist,

und/oder dass die Geometrieveränderung eine Änderung der Gesamtfläche des geänderten Entwurfs (10a) im Vergleich zur Gesamtfläche des zu ändernden Entwurfs (19) bewirkt.

30

25

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch kennzeichnet, dass mindestens eine Vorgabe für die

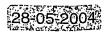
PATENTANWALT KINDERMANN

FR 10:11 FAX 0049 81 01898 h1242WCAD8.doc, 28.05.04 PCI/DE03/01862

4

Geometrieveränderung unter Nutzung einer Zufallsfunktion ermittelt wird.

- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da gekennzeichnet, dass beim Ermitteln des Bewertungsmaßes die Anzahl von Ecken (El bis E4) oder die Anzahl von Kanten (110 bis 120) in dem veränderten Entwurf (10a) oder in dem Bereich (100) ermittelt wird, und/oder dass beim Ermitteln des Bewertungsmaßes die Strombelastbarkeit (D) mindestens einer Struktur ermittelt wird, die 10 mit Hilfe des Entwurfs (10, 10a) hergestellt werden soll, und/oder dass beim Ermitteln des Bewertungsmaßes die Koppelkapazität zwischen einem Element einer herzustellenden integrierten Schaltungsanordnung und mindestens einer Struktur ermittelt wird, die mit Hilfe des Entwurfs (10, 10a) herge-15 stellt werden soll, und/oder dass beim Ermitteln des Bewertungsmaßes die Überlappung (U) zwischen einem Element einer herzustellenden integrierten Schaltungsanordnung und mindestens einer Struktur ermittelt wird, die mit Hilfe des Entwurfs (10, 10a) herge-20 stellt werden soll, und/oder dass beim Ermitteln des Bewertungsmaßes die Gesamtfläche des geänderten Entwurfs (10a) berechnet wird.
- 25 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da durch gekennzeichnet, dass das Bewertungsmaß
 ein Gesamtbewertungsmaß (GBM) ist, das aus mindestens zwei
 verschiedenen Bewertungsmaßen (BM1, BM2) ermittelt wird,
 und/oder dass Wichtungsfaktoren (W1, W2) mit voneinander verschiedenen Werten vorgegeben und zur Wichtung der Bewertungsmaße (BM1, BM2) bei der Ermittlung des Gesamtbewertungsmaßes
 (GBM) verwendet werden.



10

20

05 2004 FR 10:11 FAX 0049 81 In1242WCA08.doc, 28.05.04 PCT/DE03/D1862

5

- 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-durch gekennzeichnet, dass eine Entscheidung über das Beibehalten und/oder das Ersetzen der unveränderten Entwurfsdaten abhängig von einer Zufallsfunktion durchgeführt wird (316, 318).
- 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Abhängigkeit der Entscheidung von
 der Zufallsfunktion abhängig von der Anzahl der Zyklen (n)
 verringert wird.
- 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a durch gekennzeichnet, dass für einen Entwurf (10, 10a) ein Rastermaß gewählt wird, das gleich der Breite eines Maskenschreibstrahls ist, der zur Übertragung des Entwurfs (10, 10a) auf eine Lithografiemaske genutzt wird, oder dass für einen Entwurf (10, 10a) ein Rastermaß gewählt wird, das kleiner als die Breite des Maskenschreibstrahls ist.
- 12. Datenverarbeitungsanlage (550) zum automatischen Verändern von Entwurfsdaten für die Herstellung eines Bauteils, insbesondere einer integrierten Schaltungsanordnung, mit einer Speichereinheit (552) zum Speichern von zu verändernden Entwurfsdaten, die einen zu verändernden geometrischen Entwurf (10) für ein Bauteil festlegen, mit einer Änderungseinheit (554), die aus den Entwurfsdaten veränderte Entwurfsdaten eines veränderten Entwurfs (10a) erzeugt und in der Speichereinheit (552) speichert,

 30 mit einer Bewertungsmaßermittlungseinheit (558 bis 562), die
- aus den veränderten Entwurfsdaten ein Bewertungsmaß (GBM) ermittelt,



5

10

veranlasst,

10:11 FAX 0049 810 01898

б

wobei beim Ermitteln des Bewertungsmaßes eine für den veränderten Entwurf oder Bereich (100) ermittelte kritische Fläche bezüglich Kurzschlüssen und/oder eine für den veränderten Entwurf (10a) oder in dem Bereich (100) ermittelte kritische Fläche bezüglich Unterbrechungen ermittelt wird (310),

mit einer Vergleichseinheit, die das Bewertungsmaß (GBM) für den veränderten Entwurf (10a) mit einem Bewertungsmaß für den zu verändernden Entwurf vergleicht,

und mit einer Steuereinheit (572), die abhängig von dem Vergleichsergebnis die unveränderten Entwurfsdaten beibehält oder durch die veränderten Entwurfsdaten ersetzt, und die automatisch die Durchführung mehrerer Zyklen von Veränderungen, Vergleichen und Entscheidungen über das Ersetzen

- wobei die kritischen Fläche unter Annahme von Defekten einer 15 vorgegebenen Größenverteilung ermittelt wird und wobei die Größenverteilung so gewählt wird, dass bei der Herstellung des Bauelementes auftretende Defekte nachgebildet werden.
- 13. Datenverarbeitungsanlage (550) nach Anspruch 12, g e -20 kennzeichnet durch mindestens eine weitere Einheit, bei deren Betrieb ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11 ausgeführt wird.
- 14. Programm oder Datenspeicher mit einem Programm, das eine 25 Befehlsfolge enthält, bei deren Ausführung durch einen Prozessor (600) ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11 ausgeführt wird.